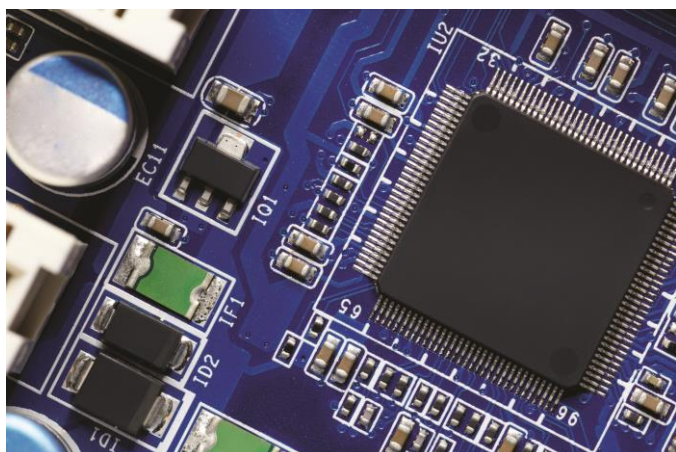


Уважаемые дамы и господа!

Приглашаем Вас 11 апреля 2019 г. принять участие в совместном семинаре компаний INTERTECH Corporation и SYNERCON

## «Аналитическое оборудование для решения задач микроэлектроники»



**11 апреля 2019 г.**

Зеленоград, Техноюнити

**Адрес проведения:**

Зеленоград, ул. Юности, д. 8 -  
Инновационный кластер Техноюнити, 11  
этаж, зал для мероприятий

Семинар посвящен аналитическому оборудованию для проведения исследований и контроля качества в микроэлектронике и полупроводниковой промышленности. В ходе семинара будут проведены презентации оптических микроскопов, ИК-Фурье и Раман спектрометров и микроскопов, профилометров, наноинденторов, измерительных микроскопов, анализаторов толщин многослойных покрытий, атомно-силовых микроскопов ведущих мировых производителей с многочисленными примерами их использования для решения конкретных задач, связанных с микроэлектроникой.

Участие в семинаре – **бесплатное**.

Для участия в семинаре необходимо до **8 апреля 2019 г.** (включительно) заполнить на каждого участника электронную регистрационную форму [по ссылке](#)

Контактные лица организаторов семинара:

- Неудачина Вера Сергеевна, к.х.н. / руководитель направления “Анализ поверхности и наноструктур” компании INTERTECH Corporation, 8-800-200-4225, моб. (916) 529-8385, [vsn@intertech-corp.ru](mailto:vsn@intertech-corp.ru)
- Юсупов Артур Аббасович / руководитель отдела микроскопии и твердометрии ООО “СИНЕРКОН”, 8-495-741-5904, моб. (915) 021-1715, [yaa@synercon.ru](mailto:yaa@synercon.ru)

**ПРОГРАММА****«Аналитическое оборудование для решения задач микроэлектроники»**

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>9.30-10.00</b>  | <b>Регистрация и кофе</b>  |
| <b>10.00-10.30</b> | Приветственное слово и обзорная информация о компаниях INTERTECH Corporation и Синеркон              |
| <b>10.30-11.00</b> | Микроскопы Leica Microsystems (Юсупов А.А., Синеркон)  |
| <b>11.00-11.30</b> | ИК-Фурье и Раман спектрометры и микроскопы Thermo Scientific (Кимстач Т.Б., INTERTECH Corporation)   |
| <b>11.30-12.15</b> | Профилометры и оптические измерители толщины KLA-Tencor (Неудачина В.С., INTERTECH Corporation)      |
| <b>12.15-13.00</b> | <b>Перерыв на ланч и обсуждение</b>  |
| <b>13.00-13.30</b> | Наноинденторы KLA-Tencor (Неудачина В.С., INTERTECH Corporation)                                     |
| <b>13.30-14.00</b> | Измерительные микроскопы Walter UHL (Еремин В.В, Синеркон)   |
| <b>14.00-14.30</b> | Анализаторы толщин многослойных покрытий Hitachi High-Tech Analytical Science (Орлов К.В., Синеркон) |
| <b>14.30-15.00</b> | Атомно-силовые микроскопы Oxford Instruments Asylum Research (Неудачина В.С., Intertech Corporation) |
| <b>15.00-16.00</b> | <b>Демонстрация оборудования, обсуждение и завершение семинара</b>                                   |

**Перечень демонстрируемого оборудования:**

- Цифровой микроскоп Leica DVM6A
- Прямой микроскоп Leica DM6
- Стереомикроскоп Leica S8 Apo
- Измерительный микроскоп Walter UHL VMM150
- Толщиномер покрытий X-Strata 920